

# MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A BALAYAGE

Service commun d'Imageries et  
d'Analyses Microscopiques



## JEOL JSM6301F



### Caractéristiques :

- Emission d'électrons par effet de champ
- Tension d'accélération de 0,5 à 30 kV
- Grandissement de 10 à 100 000
- Résolution 2 nm
- Imagerie numérique
- Platine X, Y, Z et tilt +60°

### Equipements associés :

- Logiciel de vidéo-communication
- Dessiccateur à point critique BALTEC CPD 030
- Métalliseur LEICA ACE 600 : dépôt de carbone, or ou platine

### Techniques :

- Imagerie topographique par électrons secondaires
- Imagerie de contraste chimique par électrons rétrodiffusés
- Détection moléculaire par immunomarquage

Contact :

**SCIAM** - Service Commun d'Imageries et d'Analyses Microscopiques  
[romain.mallet@univ-angers.fr](mailto:romain.mallet@univ-angers.fr) ☎ 02 44 68 84 39